Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/804,750	PITZ ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Tan V. Mai	2193	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
708	250-256	6/19/2007·	MAI	
			,	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	•			
		···		
·				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
			·	
·	·			
			·	

Inventor(s) search Double Patent Check Data Bases Search (see search history printout(s)) M. 6/19/2007 M.	(INCLUDING SEARCH		I
Data bases Search (see Search history printout(s))		DATE	EXMR
	ouble Patent Check Pata Bases Search (see search	6/19/2007	MAI
	·		-
	•		
		·	,
	•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		